

## Akion 干渉縞解析装置

東明技研の干渉縞解析装置は、レーザー干渉計で観察される干渉縞画像から、研磨面の面精度や光学素子の透過波面精度を、数値化・可視化することで、より高精度に、より分かりやすく、品質管理の向上に有益な商品です。

新たに開発したIFMは、最新のOSに対応し、新規アルゴリズムの導入により測定精度が向上し、様々なニーズに対応する解析機能を有します。操作は簡単で、どなたでもお使いいただける干渉縞解析装置です。

ご所有の干渉計にIFMを搭載する、レトロフィット（旧型を改良）にも対応いたします。

### ◆ 干渉縞解析装置：IFM



操作アイコン

測定スタート

手動マスク

詳細設定

マスク (自動/手動/半自動)

ピエゾ校正

収差リムーブ window  
Tilt/Power/Astigma/Coma/Spherical aberration and etc.

NEW

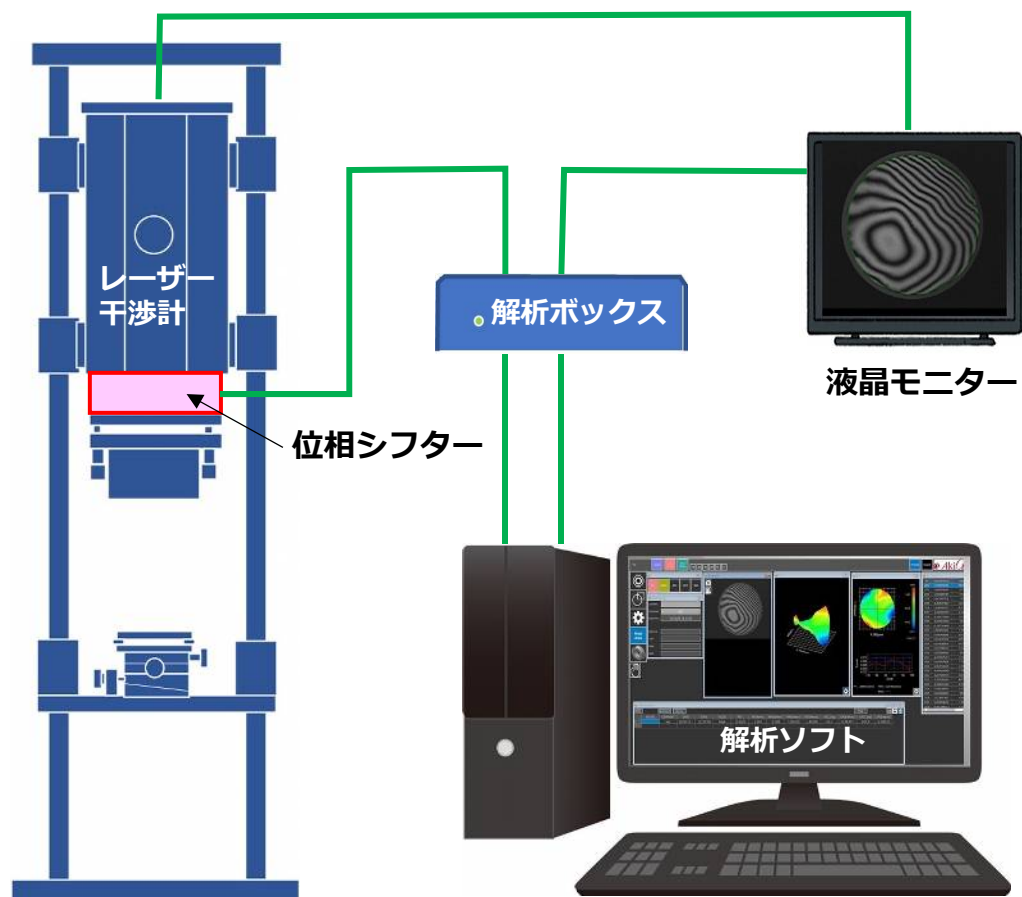
解析結果 window  
PV/RMS/Seidel's 5 aberrations/RII/RSI/Zernike coefficient/User-defined functions and etc.

### 【IFMの主な特徴】

数十社のユーザーのご意見、ご要望を基に新たな干渉縞解析装置を開発し、刷新しました。

- ・アイコンによる操作で、初心者でも容易に測定作業が可能
- ・画像処理技術の導入による位相つなぎ精度の向上
- ・様々な解析機能の追加
  - ゼルニケ係数：Fringe Zernike及びStandard Zernike係数の両方で解析可能
  - カルテシアン係数：直交座標系での解析、及び収差リムーブが可能
  - ユーザー定義関数での解析：Zernike, PV, Coma, Powerなどの演算機能
  - 位相データ演算機能：平均化処理、2球面法、3平面法など様々な解析が可能
  - 異常画像（ゴミ、キズ）自動除去機能
- ・PV値、RMS値、ザイデル収差（球面/コマ/アス）、3D（鳥瞰図）、2D（等高線図）、断面解析はもちろんのこと、IRR（Irregularity）、RSI（Rotationally Symmetric Irregularity）のISO10110-5に準拠する解析も可能
- ・オートキャリブレーション機能を搭載し、振動、空気ゆらぎ等の外乱にも強い解析が可能

◆ 干渉縞解析装置IFMシステム例



構成品目	IFM縞解析ソフト
	位相シフター
	解析ボックス: AK-CB1 (位相シフタードライバー・画像入出力用)
	パソコン、パソコンラック
解析項目	PV値、RMS値、鳥瞰図、等高線図、断面図、ザイデル収差
	ISO準拠: IRR(アスクセ)、RSI(クセ)
	極座標系: フリンジゼルニケ係数(36項)、スタンダードゼルニケ係数(45項)
	直交座標系: カルテシアン係数(7項)
	ユーザー定義関数、周波数解析他
解析画素	標準: 640 × 480pixel
	(※)高解像度デジタルセンサーにも対応可
階調	10bit
電源	AC100V 50/60Hz 500W

◆ 東明技研

〒362-0081 埼玉県上尾市壺丁目北19番-11

TEL:048-725-1193 FAX:048-725-9993

email : info\_akion@toumeigiken.com